



特許調査・解析サービス

PATENT SEARCH / ANALYSIS



確かな検索スキルと技術解析力による高精度調査

特許検索に求められる知識・経験・論理的思考力、そして公報のスクリーニングや精査を正確に実施できる技術的知見・技術解析力を持ち合わせた「特許調査のプロフェッショナル」による、高精度な調査サービスをご提供いたします。

当社では調査の受託にあたり、お客様とのコミュニケーション（ヒアリングなど）を通じて調査要件の確認と定義を十分に行ったうえで、的確な調査設計をすることに注力しています。また、サービス品質の維持・強化を図るため、高度なマネジメント体制のもとで、常に「プロセス」にこだわりながら調査の妥当性に関するチェックと検証を行っています。

50年超の実績に裏打ちされた信頼とノウハウ

日本アイアールは特許情報サービスの会社として50年超の歴史を有しています。

当社の特許調査ソリューションは、国内の主要大手メーカーを中心に、中堅・中小企業、特許事務所や法律事務所、公的研究機関や大学まで、多数のお客様にご活用頂いております。また、近年は海外の大手企業からの調査依頼も増加しています。

今日に至るまで、当社ではデータベースなどの特許調査環境の変化に柔軟に対応しつつ、様々な調査依頼者から頂くフィードバックやご要望と向き合い、地道に調査プロセスの改善を重ねております。長年にわたる大量の調査案件を通じて得られる実務ノウハウが、様々な形で社内に蓄積され続けています。

信頼性の高い外国特許調査

企業活動のグローバル化が進む中、外国特許調査の重要性は益々高まっています。

当社では外国特許の検索にあたって、調査対象国や調査の種類・目的に応じて最適な特許データベースを使い分けており、複数のデータベースを併用する案件もあります。

また、非英語圏のアジア地域の特許調査にも注力しており、ネイティブのプロサーチャーによる信頼性の高い調査を追求しています。特に中国については、1990年代の特許調査黎明期から実務を開始しており、高度なニーズに対応できる強力な調査体制を構築しております。

当社は特許調査だけではなく、特許翻訳・技術翻訳も主要業務としているため、もちろん抽出公報の翻訳まで可能です。その他、各国の訴訟情報調査や企業調査なども含め、知財関連情報のトータルサービスを提供しているアイアールならではのワンストップ対応が可能です。

品質

実績

プロの特
ソリュー

外国対応

幅広い技術領域に対応する調査・分析の実務者集団

当社の特許調査部門は、企業知財部や登録調査機関での豊富な調査実務経験を有するスタッフ、専門技術に関する高度な知見を有する技術分析スタッフ、弁理士や技術士の有資格者などで構成されており、案件ごとに最適なサーチャーチームで対応します。

技術分野は、案件数の多い電気・機械系、化学・材料系はもちろんのこと、IT・ソフトウェア関連や、バイオ・医薬関連まで、様々な調査テーマに対応できる体制を構築しています。

また、当社では一部の特殊な調査を除いて、ほぼ全ての調査案件を社内のサーチャーチームで対応しており、その内製化率の高さも特徴の一つです。

体制

リーズナブルな料金

豊富な実務経験に基づいた確かな調査設計と検索技術をベースに、調査目的や調査テーマ、予算、リスク許容度などに応じて適切と思われる調査母集団をご提案することで、お客様にとってコストパフォーマンスの高い調査サービスの提供を追求しています。

また、公報のスクリーニングや解析作業の費用については、根拠や内訳が良く分からない「一式〇〇円」のような提示はできるだけ避け、合理的な作業工数（人日）の算出によって誠実な調査料金を提示するように努めています。

（※案件の内容によっては、一式での料金提示となる場合もございます）

コスト

セキュリティ

ISO27001 認証取得の情報セキュリティマネジメント

特許調査業務では、お客様の技術情報や事業戦略情報などの多くの機密情報を扱います。

当社では、重要な機密情報を開示していただくお客様に、より安心してサービスをご利用いただけるよう情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：Information Security

Management System）の国際規格である「ISO/IEC27001：2013 / JIS Q 27001：2014」の認証を取得しています。特許調査事業者の責務として、高度な情報セキュリティ基準による管理・運用を行っております。

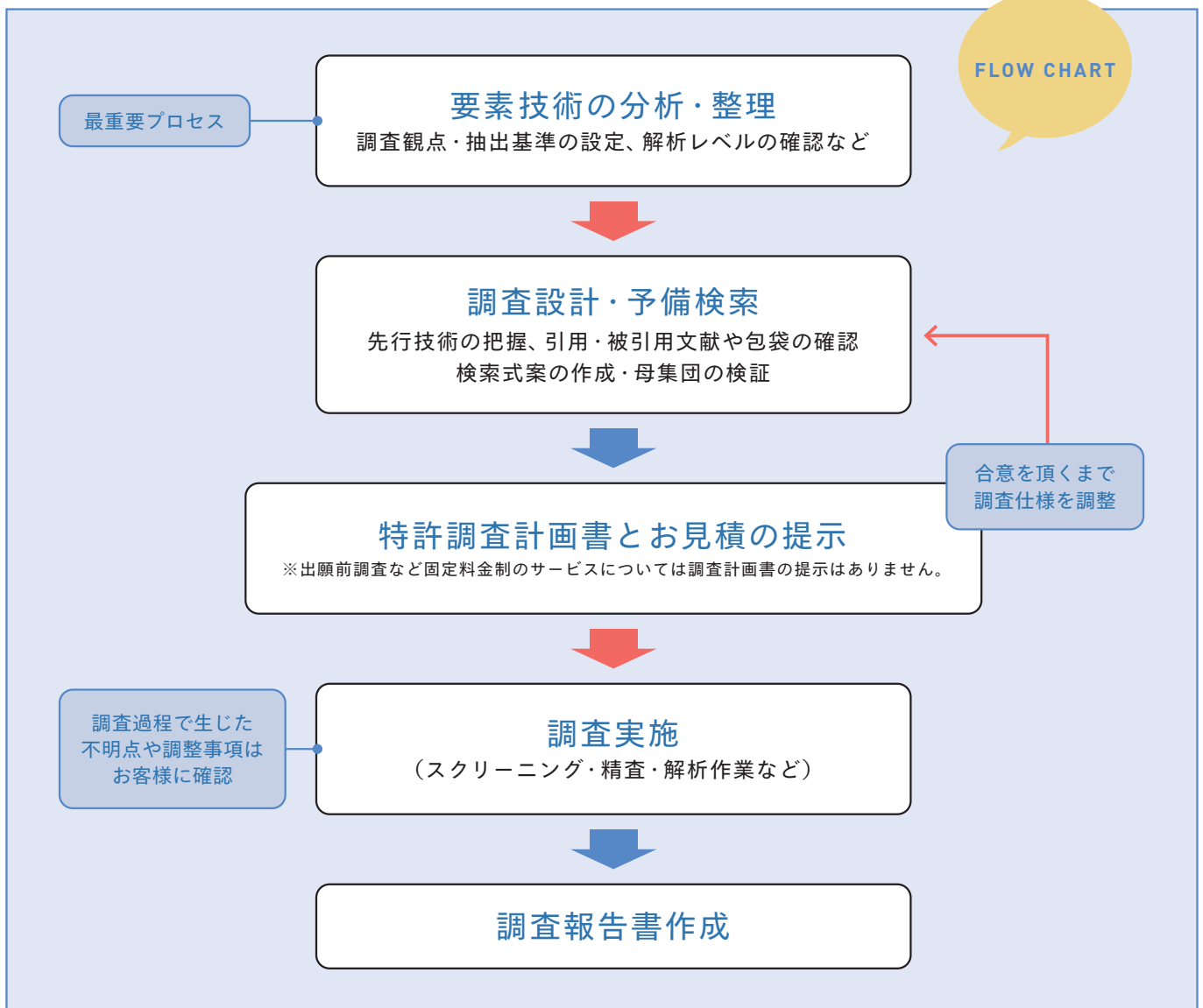




特許調査の目的

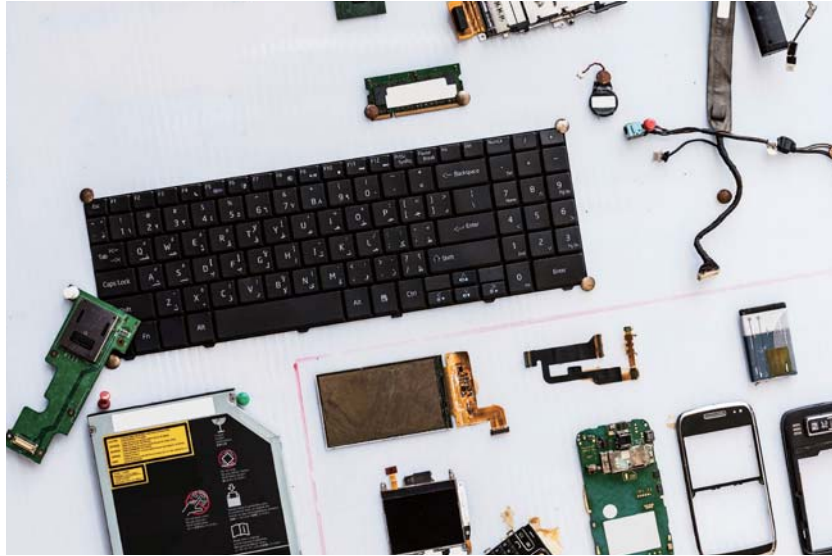
特許調査の目的を明確にすることが成功への近道です。調査観点や抽出基準をしっかりと定めなければ、本来は不要な公報まで報告せざるを得ないこととなります。調査の種類や目的によって調査母集団の作り方（検索式のロジック）、公報の読み方、抽出の仕方が異なります。目的とアプローチが異なる調査を中途半端にまとめて行うことはリスクが高く、避けた方が無難です。

戦略的特許調査のススメ



侵害予防調査

新製品の開発等にあたり、他社の特許権侵害を未然に防ぐ事を目的とした調査です。「クリアランス調査」「抵触調査」「FTO調査」などと呼ばれ、調査対象の技術（製品）と、「特許請求の範囲」の文言とを構成要素ごとに精確に対比していく必要があります。調査範囲の取捨選択の判断は調査会社だけでは難しい場合もあり、調査の内容によっては知財ご担当者様や発明者の方との入念な打合わせが必要となる場合があります。



【サンプル1】

判定 ◎(要注意) ○(判断不能) △(参考) ×(ノイズ)	備考 ※独立クレーム精査(黒字: 該当箇所/赤字: 相違する箇所/青字: 判断できない箇所)は オプションで追加可能	公開・公表番号	登録・特許番号
○	【請求項1】一端に開口した第1口部を有する内容器と、 前記内容器から所定の隙間をあけて圍繞するように配設され、一端に前記第1口部の外面に固着される開口した第2口部が設けられた外容器と、 前記内容器の外面に配設され、前記外容器の内面との間に隙間を有する1枚の耐熱コア材と、・・・前記第1口部を除いて前記内容器の底部と側部が前記耐熱コア材および前記金属はくに覆われていることを特徴とする真空断熱容器。 ・容器の仕様など判断できない項目を含むため、○(判断不能)	特開XXXX-XXXXX	特開XXXX-XXXXX
×		特開XXXX-XXXXX	特開XXXX-XXXXX
△	【請求項1】液相と気相とからなる冷媒を貯留する冷媒槽と、冷媒槽の外周を覆う真空槽とを備える真空断熱容器であって、 冷媒槽と真空槽との間に形成される真空断熱層を上部断熱層と下部断熱層とに分割する波付き板状の仕切り部を有し、 仕切り部における冷媒槽への接続箇所の下端が、真空断熱容器を利用する際の液面よりも下の位置にあり、 前記上部断熱層が、前記冷媒層のうち、冷媒の気相部分に接触する部分の外周面を主に覆うことを特徴とする真空断熱容器。 ・接続箇所の仕様が調査対象技術と異なるが、他の構成は共通点が多いため、△(参考)。	特開XXXX-XXXXX	特開XXXX-XXXXX

無効資料調査（公知例調査）

他社の特許（クレーム）を無効化するための先行技術調査です。他社との交渉や無効審判を行うために必要となる証拠資料を探します。また、対象クレームのうち、部分的に無効資料が足りないような場合は、当該部分にポイントを絞って調査することも可能です。抽出した無効資料の候補については対象クレームの構成要件ごとに対比表を作成し、比較分析することが一般的です。



【サンプル2】

『特許第XXXXXXX号』に対する対比表

特許第XXXXXXX号 (●●株式会社) 〔請求項1〕		① 特開平8-3XXXX9 (AA機械工業、他)	② 特開200X-2XXXX4 (BB工業)	③ 特開20××-0XXX81 (CC電気)	④ 特開平X-1XXX63 (DD精密)	⑤ 特開20XX-1XXX07 (EE機械、他)
A	■目つ●●を有する基板の一主面上に形成された▲▲▲▲層を有する▲▲▲▲が、 前記基板の●●を表面側として●●性もしくは◆◆性を有する基材上に保持されてなる▲▲▲▲モジュールであって、	○	○	△	○	
B	前記基板と前記基材との間に、前記▲▲▲▲層を○○する◆◆又は○もしくは●●、及び●●性を有する材料からなる■層を介挿すると共に、			○	△	△
C	前記▲▲▲▲層と基材との間に、■性を有し目つ◆◆又は■性もしくは●●を有する材料からなる接着層を◆◆的に設けたことを特徴とする				△	△
	▲▲▲▲モジュール。					

PATENT SEARCH / ANALYSIS

予算に制約がある場合は予めご相談ください

調査漏れリスクを減らすために、分類の範囲やキーワードをどこまでも広げていけば、当然ながらノイズの比率も高まり非効率な調査に繋がります。読み込み調査の工数は、基本的には母集団の数に比例しますので、それに応じて調査費用も高くなってしまいます。予算に制約がある場合は、予め金額をお知らせ頂いた方が、優先度の高い方からコストに合わせて最適な調査母集団を検討することができます。当社では、「予算内で対応できる範囲としてはベターと思われる母集団」をご提案させて頂くことも可能です。

出願前調査・審査請求前調査

特許出願前や審査請求前に類似する発明を調査して抽出します。特許出願や審査請求にあたり先願の公報を把握することで、重複出願や権利化の見込みがない発明の出願や審査請求を排除でき、コストダウンにつながります。また、先行技術を知ることで、自分と他人の発明を比較することができ、自分の発明をブラッシュアップすることができます。当社では特に要望が無ければ、重要性の高いFI・Fターム・キーワードの組み合わせから200件程度を目安とした母集団を作成して調査しています。



先行技術調査（資料収集型）



新規事業分野への進出や自社製品の改良などで、既存の技術を把握・分析する必要がある場合に、調査対象技術に関連する特許公報をすべて抽出してご報告いたします。公報のどの部分に何が書いてあったら抽出すべきかなど、「抽出する公報の基準」を明確に定義して頂くことが、良質なアウトプットにつながります。また、追加で技術内容に応じたフラグ分けなどの解析作業も可能です。お客様のご予算に応じて、最適な検索式と調査プランをご提案いたします。

非特許情報調査

各種学術論文や公開技報等の特許以外の文献（非特許文献）や、IPランドスケープをサポートする海外企業のプレスリリース、ニュースなど非特許情報の調査にも対応。技術調査のエキスパートが世界の技術情報を収集・分析いたします。

また、無効資料調査等において特許文献から有効な資料が見つからなかった場合は、非特許文献を調査することも手段の一つです。当社では各種文献データベースを使用した検索や、候補文献の抽出調査も承ります。無効資料調査で行き詰った場合の「最後の手段」としてご利用下さい。

その他の調査関連サービス

検索式作成サービス

公報を読むのは得意だが検索式を作成するのは苦手という方や、作成した検索式に不安のある方、検索式作成の時間が惜しい方は検索式作成サービスをご利用ください。熟練したプロのサーチャーがご希望に合わせた精度の高い検索式を作成致します。

パテントファミリー調査

INPADOCベースのパテントファミリー情報は、各種データベースから簡単に取得できます。しかし、INPADOCに収録されない（収録が遅い）新興国などは、優先権情報から対応特許を確認するなどの手間がかかります。パテントファミリーの確認が、面倒な仕事となる場合は当社にお任せください。

ステータス調査・経過情報ウォッチング

競合他社等の気になる特許出願、または権利の最新ステータスや審査経過情報を調査します。日本の特許についてはステータス調査に対応する各種データベースの充実ぶりが顕著ですが、外国については必ずしもそうではありません。希望される対象国に応じて、対応の可否、調査手法や料金をご案内いたします。

SDI(定期調査)

自社にとって重要性の高いテーマについては、一度遡及調査を実施した後も継続的に監視することが重要です。当社ではお客様のニーズによって様々なアウトプットをご提案させて頂いております。また、調査担当の皆さまの手間を大幅に削減できる「スクリーニング付きSDI」は、多くのユーザー様にご利用頂いている人気サービスです。



無効資料調査（公知例調査）

以下の料金表は、一般的な案件における標準料金です。ご依頼内容によって料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。

日本特許調査の標準料金表

特許調査の内容	標準価格（税抜）	備考
出願前調査 ※調査件数 200 件程度	65,000 円～（1 発明あたり）	バイオ関連など一部の技術分野については別途見積りとなります。
審査請求前調査 ※調査件数 200 件程度	基本料金：65,000 円～（独立項 1 項あたり） クレーム追加料金：5,000 円～（従属項 1 項あたり）	バイオ関連など一部の技術分野については別途見積りとなります。
特許侵害予防調査 （クリアランス調査）	調査母集団の件数等により異なります。調査の作業工数ベースで費用をお見積りいたします。	
特許無効資料調査 （公知例調査）	調査母集団の件数等により異なります。調査の作業工数ベースで費用をお見積りいたします。 （※ミニマム料金：100,000 円）	構成要件対比表の作成要否によって費用が変動します。
先行技術調査 （技術動向調査、資料収集調査等） 特許解析／特許マップ作成等	調査の仕様、母集団の件数等により異なります。作業工数ベースで費用をお見積りいたします。	

- ◆日本特許調査の作業工数単価目安：39,000 円～49,000 円／人日
- ※調査対象の技術分野によって単価が異なります。
- ※検索式作成のみのご依頼となる場合は、検索式作成費用（30,000 円～）を承ります。

外国特許調査の標準料金表

特許調査の内容	標準価格（税抜）	備考
検索基本料金 （米国／EP／WO）	20,000 円／テーマ	英語以外の KW 検索は別途キー料金がかかります。
検索基本料金 （中国／韓国／台湾／東南アジア等）	30,000 円／テーマ	英語以外の KW 検索は別途キー料金がかかります。
出願前調査（英語検索）	95,000 円～（1 発明あたり）	英語以外の検索は別途見積りとなります。
特許侵害予防調査 （英語／中国語／韓国語）	調査母集団の件数等により異なります。調査の作業工数ベースで費用をお見積りいたします。	
特許無効資料調査 （英語／中国語／韓国語）	調査母集団の件数等により異なります。調査の作業工数ベースで費用をお見積りいたします。 （※ミニマム料金：150,000 円）	構成要件対比表の作成要否によって費用が変動します。
先行技術調査 （技術動向調査、資料収集調査等） 特許解析／特許マップ作成等	調査の仕様、母集団の数に応じて異なります。作業工数ベースで費用をお見積りいたします。	

- ◆外国特許調査（英文）の作業工数単価目安：45,000 円～56,000 円／人日
- ※調査対象の技術分野によって作業単価が異なります。
- ※検索式作成のみのご依頼となる場合は、検索基本料金と検索式作成料金（50,000 円～）を承ります。
- ◆中国特許・韓国特許のネイティブサーチャーによるマニュアル調査については、案件ごとにお見積りいたします。

その他の調査

調査の内容	標準価格（税抜）	備考
特許 SDI サービス（定期調査）	基本料金（日本）：2,000 円～／月 基本料金（外国）：5,000 円～／月	基本料金以外は納品形式により異なります。
非特許情報調査	・ 検索代行料金：DBによって異なります。 ・ 文献確認料金：文献の取寄せ・複写の費用、図書館への出張費、文献の内容確認作業の工数等により異なります。	

特許調査サービスについてよくあるご質問

Q. 特許調査を外部委託したことが無いのですが、どのように依頼すればよいですか？

A. お電話やメールでご連絡いただければ、調査担当者が調査に必要な情報を確認させていただき、最適な調査方法をご説明、ご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

Q. 見積もりは無料ですか？

A. 一部の調査を除いて、原則として無料に対応しております。従量制の有料データベースを使用する調査の場合や、東南アジアなどの現地語検索が必要な場合は、予備検索費用がかかります。

Q. 調査を依頼するにあたって、打ち合わせは可能ですか？

A. ご要望に応じて担当サーチャーがWEB会議ツール等で、打ち合わせ・ヒアリングをさせていただきます。首都圏のお客様についてはサーチャーが随時ご訪問させて頂いているほか、当社にご来社いただいで打ち合わせをすることも可能です。

Q. 納期はどれくらいですか？

A. 出願前調査・審査請求前調査は約2週間が標準納期です。侵害予防調査や無効資料調査については約1ヶ月が標準的な目安です。ただ、調査母集団のボリュームやアウトプットの形式、当社で受託している調査案件の状況などによって異なりますので、見積時に個別にご提示いたします。

Q. 至急料金によって納期を早めてもらうことは可能ですか？

A. 当社では、出来る限りの最短納期を提示するように努めていますが、残業を前提にした至急対応には対応しておりません。検索やスクリーニングは高度な集中力が求められる作業ですが、当然ながら人間が集中できる時間には限界があり、長時間の作業には注意力低下による調査ミスが生じるリスクがあると考えているためです。

ご不明な点やご相談につきましては、当社特許調査担当者までお気軽にお問い合わせください。

日本アイアール株式会社 特許調査部
電話：03-6206-4966 メール：ir@nihon-ir.co.jp





日本アイアール メインHP

<https://www.nihon-ir.jp>

日本アイアール株式会社

〒101-0033

東京都千代田区神田岩本町15-1

CYK 神田岩本町3階

電話：03-6206-4966

E-mail: ir@nihon-ir.co.jp